

略語（本号で使った主な略語）

AE	Acoustic Emission	
CGL	Charge Generation Layer	電荷発生層
CGM	Charge Generation Material	電荷発生材料
CTL	Charge Transport Layer	電荷輸送層
CTM	Charge Transport Material	電荷輸送材料
CVD	Chemical Vapor Deposition	化学蒸着
DLC	Diamond Like Carbon	
ECC	Exchange-Coupled Composite	
EFM	Electrostatic Force Microscope	静電気力顕微鏡
ETM	Electron Transport Material	電子輸送材料
HDD	Hard Disk Drive	ハードディスクドライブ
HDI	Head Disk Interface	
HTM	Hole Transport Material	正孔輸送材料
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry	
LED	Light Emitting Diode	発光ダイオード
MASPP	Micro Area Surface Potential Probe	微小面積表面電位測定プローブ
OPC	Organic Photoconductor	有機感光体
OSA	Optical Surface Analyzer	
POD	Pin on Disk	
SCAF	Series-Connection through Apertureformed on Film Substrate	
SEM	Scanning Electron Microscope	走査型電子顕微鏡
SNR	Signal to Noise Ratio	信号対雑音比
SSD	Solid State Drive	半導体ドライブ
SWR	Shingled-Write Recording	瓦書き記録方式
TAMR	Thermally-Assisted Magnetic Recording	熱アシスト磁気記録方式
TDMR	Two Dimensional Magnetic Recording	二次元磁気記録
TEM	Transmission Electron Microscope	透過型電子顕微鏡
TMR	Tunnel Magneto-Resistance Effect	トンネル磁気抵抗効果
UCL	Under Coat Layer	下引き層
VSM	Vibrating Sample Magnetometer	振動試料型磁力計



*本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。